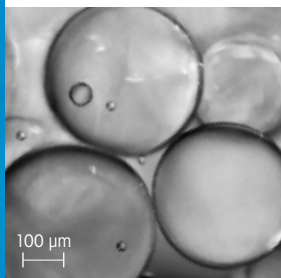
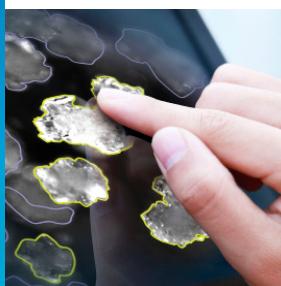


Beobachten und messen Sie Partikel in situ und in Echtzeit



Experimentelle Einblicke

Erfassen Sie hochauflösende Bilder von Partikeln, Kristallen und Tröpfchen in situ, für ein tieferes Prozessverständnis von komplexen chemischen Systemen. Untersuchen Sie Kristallisationen, Ausfällungen, Suspensionen und Emulsionen mit unerreichter Detailgenauigkeit und Gewinn neuer Erkenntnisse, für fundierte Entscheidungen.



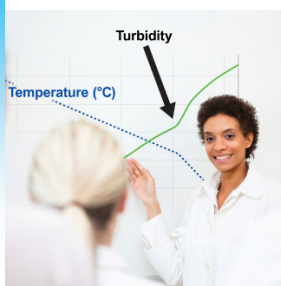
Leistungsstarke Analytik

Machen Sie den EasyViewer mit Bildanalyse in iC Vision zu einem leistungsstarken Analysator für Partikelgröße und Form. Überwachen Sie Prozessänderungen und quantifizieren Sie Partikelgröße und Form mit individuellen Algorithmen. Nutzen Sie Vergleiche mit bereits erfassten Bildern für ein schnelleres Design von Partikeln.



Flexibilität beim Scale-up

EasyViewer 400 eignet sich für Labor und Produktion – dank der kleinen Ausführung mit einem Messfühler und des flexiblen Montagesystems, das in Reaktoren, Versuchsbehälter und Rohrleitungen passt. Untersuchungen im kleinem Maßstab können direkt mit Ergebnissen des Scale-up verglichen und Risiken minimiert werden.



Zuverlässiger Einsatz

Nutzen Sie die Softwarefunktionen Autofokus, automatische Belichtung und Auto-Save Best-Image, um sicherzustellen, dass jedes Mitglied des Projektteams von Anfang bis Ende der Experimente Bilder von höchster Qualität sammeln, um nichts zu verpassen.



EasyViewer 400

EasyViewer™ 400 ist ein sondenbasiertes Bildgebungs-tool, das hochauflösende Bilder von Kristallen, Partikeln und Tröpfchen während des Prozesses aufnimmt. In Kombination mit iC Vision™, einer benutzerfreundlichen Bildanalysesoftware, wird der EasyViewer zu einem leistungsstarken Analysetool, mit dem Prozess-änderungen überwacht und Partikelgröße und Form in Echtzeit quantifiziert werden können. Der EasyViewer kann Partikelprozesse maßstabsübergreifend abbilden und unterstützt so Prozess Scale-up, Transfer und Produktion. Das EasyViewer-Gerät verbindet leistungsfähige Datenerfassung mit ausgezeichneter Benutzerfreundlichkeit, für schnellere Entscheidungsfindung und optimierte Prozessentwicklung.

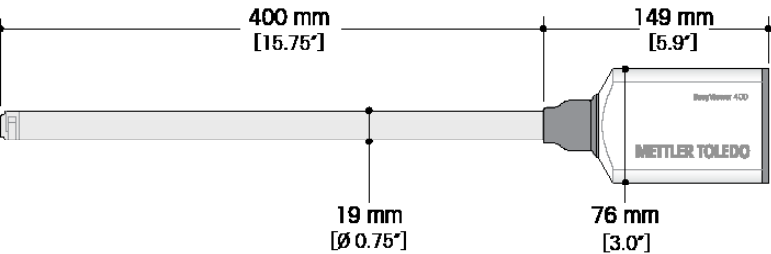
Beobachten und messen Sie Partikel in situ und in Echtzeit

Technische Daten

Medienberührte Teile der Sonde Probe Wetted Material	C-22-Legierung, PTFE, Saphir
Werkstoff Sondenfenster	Saphir
Sensordurchmesser	19 mm [0.75 in]
Medienberührte Sensorlänge	400 mm [15.75 in]
USB-Kabellänge	3 m (Standard)
Sichtbarer Bereich	1100 µm x 800 µm (± 50 µm)
Optische Auflösung	> 980 nm
Laserwellenlänge	450nm
Beleuchtungsmodi	Vorderseite, Rückseite
Sondengewicht	1,45 kg
Temperaturbereich medienberührte Sonde	10 °C bis 100 °C (Standard) 10 °C bis 150 °C (kundenspezifisch); -80 °C bis 100 °C (Standard gespült) -80 °C bis 150 °C (kundenspezifisch gespült)
Temperaturbereich am hinteren Sondenende	0 °C bis 40 °C (eingeführt bis 300 mm) 0 °C bis 25 °C (eingeführt bis 400 mm)
Druckbereich medienberührte Sonde	bis zu 10 barg (Standard); bis zu 80 barg (kundenspezifisch)
Druckluftversorgung (zur Kondensationsvermeidung bei Betrieb unterhalb des Taupunkts)	2.0 barg [30 psig]; 0.5 SLPM (0.02 SCFM) (saubere, trockene Luft in Instrumentenqualität oder Stickstoff-Spülgas)
Zertifizierung	CE/NRTL-C zugelassen, Laser Klasse 1, gemäß 21CFR1040.10 und 1040.11 und IEC 60825-1.

EasyViewer 400 ist nicht für explosionsgefährdete Bereiche geeignet.

Sondenabmessungen



www.mt.com/EasyViewer

Weitere Informationen unter

METTLER TOLEDO Group
Automatische Reaktoren und In-situ-Analyse
Ansprechpartner vor Ort: www.mt.com/contacts

Technische Änderungen vorbehalten,
© 05/2026 METTLER TOLEDO. Alle Rechte vorbehalten.
L026119DE